

## **L'assurance qualité : Sibress présente son nouveau microscope SibScope**

**Starnberg (Allemagne), le 5 mai 2015 – Sibress est un fabricant de systèmes de mesure et d'analyse pour le contrôle de qualité dans les domaines de l'impression d'emballages et de la flexographie. L'entreprise basée à Starnberg, près de Munich, lance sur le marché un nouveau microscope SibScope ainsi qu'un logiciel de mesure SibView.**

Le nouveau microscope développé par Sibress, SibScope, permet d'examiner des objets comme l'anilox, les gravures ou les plaques de flexographie, à l'aide d'images d'une qualité et d'une netteté exceptionnelles. L'agrandissement maximal permet de représenter les objets avec une dimension de 97 µm à l'aide d'un zoom 80x en plein écran (basé sur une diagonale d'écran de 60 cm). SibScope peut être utilisé sur des surfaces rondes ou cylindriques (à partir de 6 cm de diamètre) ainsi que sur des surfaces planes.

### **Haute résolution grâce à une technologie de filtre**

Le microscope est équipé de cinq objectifs planachromatiques (objectifs à champ plein). L'agrandissement souhaité est obtenu en tournant simplement le révoluer à objectifs. SibScope est doté des objectifs suivants : 5x, 10x, 20x, 40x, 80x ainsi que 4x et 100x en option. Une variété de filtres mécaniques sont disponibles et permettent de représenter les surfaces avec une haute résolution et beaucoup de contrastes.

Afin d'inspecter les objets, l'utilisateur a le choix entre une loupe binoculaire x10 fournie ou une caméra de microscope haute résolution intégrée. L'image peut être visualisée sur l'écran d'un ordinateur. L'objectif du microscope peut être déplacé sur les axes X, Y et Z (réglage de la hauteur). Afin de déterminer la hauteur/profondeur, un comparateur numérique avec une résolution de 1 µm a été intégré au SibScope. Le réglage manuel de la hauteur permet une précision largement inférieure à 1 µm. Ainsi, il est possible de zoomer sur les plus petites structures d'une surface et de les examiner avec une netteté exceptionnelle.

Lors des mesures, une interface spéciale permet de transférer immédiatement les données concernant la hauteur au nouveau logiciel développé par Sibress fourni avec le microscope, SibView. SibView affiche également automatiquement l'objectif planachromatique sélectionné. Ainsi, pour chaque objectif, les paramètres enregistrés dans le logiciel sont configurés automatiquement, permettant un affichage approprié des mesures.

### **SibView – bien plus qu'un outil de mesure**

Le système est calibré avec les axes X, Y et Z. Le logiciel SibView offre divers outils de mesure : mesure de la distance, position angulaire, comparaison des positions angulaires, mesure de distance de la largeur avec position angulaire, cercle, circonférence et surface. Il est également possible d'ajouter des commentaires sur les images.

Pour les prises de vue avec la mesure de la hauteur, l'image et les mesures sont enregistrées ensemble et peuvent également être téléchargées ensemble. Une fonction de mémorisation rapide des images spécialement développée permet à l'utilisateur d'enregistrer en une fraction de seconde l'image et les données concernant la profondeur/hauteur correspondantes. L'image et les informations relatives à la profondeur/hauteur peuvent être enregistrées dans n'importe quel fichier et ce, sans devoir nommer l'image. Ainsi, il est possible de transformer les prises en une image 3D à l'aide d'un autre logiciel.

### **SibScope – plus qu'un simple microscope pour examen des surfaces**

Le microscope SibScope peut également être utilisé avec le logiciel Versatile@Flex de Sibress, disponible en option. Il permet d'analyser les plaques flexographiques. Le logiciel Flexo, qui jouit d'une bonne renommée sur le marché depuis quelques années déjà, analyse automatiquement divers paramètres comme le pourcentage de trame, la taille du point de trame, la largeur de trame et bien plus encore. En outre, il permet de déterminer la profondeur de relief exacte des plaques de flexographie. Les points de trame peuvent enfin être examinés en haute définition et ainsi de manière réaliste. Cela est particulièrement avantageux pour les applications de flexographie HD. La différence exacte de hauteur entre les différents points de trame peut être déterminée de manière fiable, tout comme la circonférence effective d'un point à n'importe quel endroit.

La combinaison des fonctionnalités des deux logiciels fait de SibScope une solution idéale pour les entreprises de flexographie dotées de leur propre reprographie et qui souhaitent analyser leurs rouleaux anilox ainsi que leurs plaques de flexographie.

En outre, grâce à son filtre optique, SibScope convient également aux sociétés de gravure ou pour l'examen des structures de cartes à circuits imprimés. Il sera utile partout où l'examen et l'analyse des plus petits détails à l'aide d'une résolution et d'une netteté exceptionnelles sont nécessaires.

Pour plus d'informations sur la gamme de produits de Sibress, veuillez consulter le site [www.sibress.com](http://www.sibress.com).

**Édité par PR KOM pour le compte de**

Sibress

Karwendelstraße 24

82319 Starnberg

Allemagne

Interlocuteur : Michael Romanowski

Tél. +49 (0)8151 550 85 22

E-mail : [info@sibress.com](mailto:info@sibress.com)

[www.sibress.com](http://www.sibress.com)